

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 9 月 1 日 (01.09.2005)

PCT

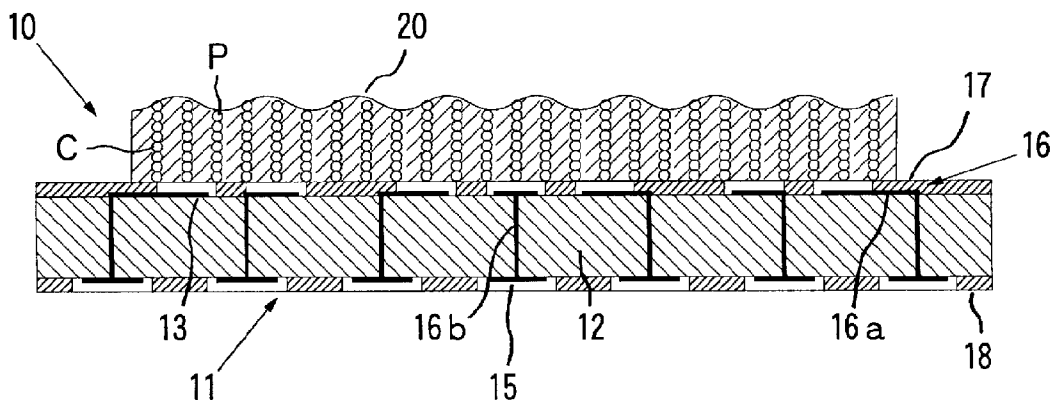
(10) 国際公開番号
WO 2005/080996 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G01R 1/06, 31/02, H01R 11/01 (72) 発明者; および
(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/002441 (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 木村 潔
(22) 国際出願日: 2005 年 2 月 17 日 (17.02.2005) (KIMURA, Kiyoshi) [JP/JP]; 〒3501236 埼玉県日高市
(25) 国際出願の言語: 日本語 猿田 2 8 9 番地 1 株式会社 J S R マイクロテック
(26) 国際公開の言語: 日本語 内 Saitama (JP). 下田 杉郎 (SHIMODA, Sugiuro) [JP/JP];
(30) 優先権データ: 〒3501236 埼玉県日高市猿田 2 8 9 番地 1 株式会社
特願2004-048158 2004 年 2 月 24 日 (24.02.2004) JP J S R マイクロテック内 Saitama (JP).
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): J S R
株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒1040045 東
京都中央区築地五丁目 6 番 1 0 号 Tokyo (JP). (74) 代理人: 大井 正彦 (OHI, Masahiko); 〒1010062 東京
都千代田区神田駿河台三丁目 4 番地 日専連朝日生
命ビル Tokyo (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

/ 続葉有 /

(54) Title: ADAPTER FOR CIRCUIT BOARD EXAMINATION AND DEVICE FOR CIRCUIT BOARD EXAMINATION

(54) 発明の名称: 回路基板検査用アダプターおよび回路基板検査装置



(57) Abstract: An adapter for circuit board examination and a circuit board examination device having this are disclosed. Even if electrical examination on many circuit boards to be examined is carried out continuously, the examination work is carried out smoothly, and the lifetime intrinsic to an anisotropic conductive elastomer sheet is obtained. Further, even if the anisotropic conductive elastomer sheet is damaged, it can be easily replaced with a new one. The adapter for circuit board examination comprises a wiring board for connection on the surface of which a plurality of connecting electrodes are so formed as to correspond to the electrodes to be examined and an anisotropic conductive elastomer sheet installed removably on the surface of the wiring board for connection. Of the anisotropic conductive elastomer sheet, the surface to be brought into contact with the circuit board to be examined has a surface roughness of 0.5 to 5 μm , and the back surface in contact with the wiring board for connection has a surface roughness of 0.3 μm or less. The wiring board for connection has an insulating layer formed in such a way that each connecting electrode is exposed on the surface of the board. The surface roughness of the insulating layer is 0.2 μm or less.

(57) 要約: 多数の被検査回路基板の電気的検査を連続して行った場合でも、検査作業が円滑に遂行され、異方導電性エラストマーシート本来の使用寿命が得られ、異方導電性エラストマーシートが故障しても、新たなものに容易に交換することができる回路基板検査用アダプターおよびこれを具えた回路基板検査装置が開示されている。本発明の回路基板検査用アダプターは、

/ 続葉有 /

WO 2005/080996 A1



ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

表面に複数の接続電極が被検査電極に対応して形成された接続用配線板と、接続用配線板の表面上に着脱自在に設けられた異方導電性エラストマーシートとを具え、異方導電性エラストマーシートは、被検査回路基板に接触される表面の表面粗さが0.5～5μm、接続用配線板に接する裏面の表面粗さが0.3μm以下で、接続用配線板は、表面に接続電極の各々が露出するよう形成された絶縁層を有し、絶縁層の表面の表面粗さが0.2μm以下である。